

נתקבל 1 4 -116- 1995 טליא איתן - זאנ פרל ושתי

This is to certify that annexed hereto is a true copy of the documents as originally deposited with the patent application particulars of which are specified on the first page

זאת לתעודה כי רצופים כזה העחקים נכונים של המסמכים שהופקרו לכתחילה עם הכקשה לפטנט לפי הפרטים הרשומים בעמוד הראשון של הנספת.

Ceptified

חוק הפטנטים,התשכ"ז - 1967 PATENTS LAW, 5727-1967 בקשה לפטנט - Application for Patent

מספר 1 1 3 8 2 9 Number 2 3 -05- 1995 :תאריך: Ante/Post-dated

Israeli Company

אני (שם המבקש, מענו ולגבי גוף מאוגד - מקום התאגדותו) (Name and address of applicant, and in case of body corporate-place of incorporation)

Name of Applicant & Address in English Nova Measuring Instruments Ltd. P.O.Box 266 Weizman Scientific Park Rehovot 76100 Name of Applicant and Address in Hebrew נובה מכשירי מדידה בע"מ
ת.ד. 266
קרית ויצמן
רחובות 76100

בעל אמצאה מכח החוק ששמה הוא
Owner, by virtue of the law of an invention the title of which is

מכשיר לבדיקה אופטית של פרוסות מוליך למחצה במהלך ליטוש

Hebrew - עברית

Apparatus for Optical Inspection of Wafers During Polishing

באנגלית - English

hereby apply for a patent to be granted to me in respect thereof

מבקש בזאת כי ינתן לי עליה פטנט

בקשת פטנט מוסף Application of Division Application for Patent Addition		דרישה דין קדימה Priority Claim		
מבקש הפטנט From Application	To Patent/Appl. לבקשה/לפטנט Noמס'	מספר/סימן Number\Mark	Date - תאריך	מדינת האגוד Convention Country
No סא	dated מיום			
dated תאריך				
יפוי-כח:כללי\מיוחד-רצוף בזה\עוד יוגש POA:general\ individual-attached \to be filed later filed in case				
Address for Service in Israel המען למסירת מסמכים בישראל , משרד עורכי דין טלי א. איתן - זאב פרל ושותי רח' משכית 22 א.ת. הרצליה, 82441				
Signature of Applicant	חתימת המבקש			
עבור המבקש,		1994 היום 23 חודש מאי שנת of the year of This		
משרד עורכי דין, טלי א. איתן - זאב פרל ושותי			לשימוש הלשכה במו Uso	
c:P-10-743-1L			For Official Use	

טופס זה, כשהוא מוטבע בחותם לשכת הפטנטים ומושלם בספר ובתאריך ההגשה, הנו אישור להגשת הבקשה שפרטיה רשומים לעיל.
This form, impressed with the Seal of the Patent Office and indicating the number and date of filing, certifies the filing of the application the particulars of which are set out above.

Apparatus for Optical Inspection of Wafers During Polishing

מכשיר לבדיקה אופטית של פרוסות מוליך למחצה במהלך ליטוש

A. Tally Eitan-Zeev Pearl & Co. Law Offices P-IO-743-IL